

X線光電子分光分析装置（XPS,ESCA）による分析

X線光電子分光分析装置は、物質表面に軟 X 線を照射した時に発生する光電子のエネルギーとその数を測定することにより、試料表面に存在する元素量や元素の周囲環境すなわち元素の化学的結合状態を知る機器です。

絶縁物を含むあらゆる固体表面層数十Åの分析が可能であり、イオンエッチングを行なうことにより、深さ方向の変化も知ることができます。



装置性能

装置 島津製作所製 ESCA-1000
分解能 Ag3d5/2 で 1.15eV のとき 700000CPS
試料測定面積 最大 3×10mm 最小 0.2mmΦ
励起 X 線源 Mg/Al
平成 16 年よりデータ処理システム Vision2 を採用

分析費用、分析所要時間

分析費用	1 試料	表面分析	10,000 円
		深さ分析	相談
分析の結果	原則として 1 週間後		

分析内容

ワイド分析による元素分析
ナロー分析による元素分析
定量分析、定性分析、深さ分析

(測定依頼および相談は 0238-26-3760 の 村山 勉 まで)